

А. И. Заико

ИНФОРМАЦИОННЫЙ КРИТЕРИЙ РАВНОМЕРНОЙ ДИСКРЕТИЗАЦИИ СЛУЧАЙНОГО ПРОЦЕССА ЗАИКО

Предложен алгоритм выбора шага равномерной дискретизации случайного процесса с равномерным законом распределения, позволяющий нормировать потери измерительной информации из-за дискретности показаний. *Информационный критерий; равномерная дискретизация; случайный процесс*

Дискретизация во времени и квантование по уровню являются первыми и поэтому наиболее ответственными операциями при обработке динамических сигналов. При этом часть измерительной информации безвозвратно теряется. Оценить количество извлекаемой информации и ее потери можно с помощью информационных критериев, которые изложены в [1–4].

В статье эта актуальная задача решена для оригинальной модели измеряемого сигнала, который описывается стационарным случайным процессом с равномерным законом распределения [5, 6]. Он адекватен реальным сигналам и характеризуется всего тремя параметрами: нижней X_H и верхней X_B границами изменения, а также нормированной корреляционной функцией $\rho_{ij} = \rho(t_j - t_i)$, где $t_j - t_i$ – сдвиг во времени между i и j сечениями процесса, $i, j = 1, 2, \dots$. Через эти параметры выражаются все многомерные характеристики процесса и они легко идентифицируются [7].

С учетом введенных обозначений одномерная априорная плотность вероятности $w_1[X_1]$ случайного X_1 процесса в момент времени t_i равна

$$w_1[X_1] = \begin{cases} \frac{1}{X_B - X_H}, & X_H \leq X_1 \leq X_B; \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Соответствующая ей априорная дифференциальная энтропия первого измерения [8]

$$h = - \int_{-\infty}^{\infty} w_1[X_1] \ln w_1[X_1] dX_1 = \ln(X_B - X_H).$$

Погрешность измерительного канала (ИК) системы в каждом показании x_{ij} считаем независимой и распределенной равномерно в пределах ширины кванта $2\Delta_k$ с плотностью вероятности

$$w_1[\Delta] = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta_k}, & -\Delta_k \leq \Delta \leq +\Delta_k; \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases} \quad (1)$$

Подставив в выражение (1) $\Delta = x_{ij} - X_i$, получим апостериорную плотность вероятности $w_1[X_i | x_{ij}]$ i -го показания x_{ij} , соответствующего j -й отметке шкалы

$$w_1[X_i | x_{ij}] = \begin{cases} \frac{1}{2\Delta_k}, & x_{ij} - \Delta_k \leq X_i \leq x_{ij} + \Delta_k; \\ 0, & \text{в остальных случаях.} \end{cases}$$

Тогда апостериорная энтропия i -го измерения [8]

$$h(x_{ij}) = - \int_{-\infty}^{\infty} w_1[X_i | x_{ij}] \ln w_1[X_i | x_{ij}] dX_i = \ln 2\Delta_k. \quad (2)$$

Количество информации $I(x_{1g})$, извлекаемое в первом измерении, результатом которого является показание ИК x_{1g} , равно [8]

$$I(x_{1g}) = h - h(x_{ij}) = \ln \frac{X_B - X_H}{2\Delta_k} = \ln \frac{\sigma_x}{\sigma_\delta},$$

где $\sigma_x = (X_B - X_H)/2\sqrt{3}$ и $\sigma_\delta = \Delta_k/\sqrt{3}$ – среднеквадратические значения, соответственно, измеряемого сигнала и погрешности ИК.

К моменту второго измерения $t_2 = t_1 + T_0$, где T_0 – шаг равномерной дискретизации, условная плотность вероятности $w_1[X_2 | x_{1g}, T_0]$ из-за вероятностной зависимости его от показания x_{1g} равна

$$w_1[X_2 | x_{1g}, T_0] = \begin{cases} \frac{1}{X_B(x_{1g}, T_0) - X_H(x_{1g}, T_0)}, & X_H(x_{1g}, T_0) \leq X_2 \leq X_B(x_{1g}, T_0); \\ 0, & \text{в остальных случаях,} \end{cases}$$

где разность условных верхней и нижней границ изменения X_2

$$\begin{aligned} X_B(x_{1g}, T_0) - X_H(x_{1g}, T_0) &= \\ &= X_B - X_H - \rho_{12}(X_B - X_H - 2\Delta_K), \end{aligned}$$

причем ρ_{12} – нормированная корреляция значений X_1 и X_2 случайного процесса между моментами времени t_1 и t_2 .

Априорная дифференциальная энтропия $h(x_{1g}, T_0)$ второго измерения реализации случайного процесса

$$h(x_{1g}, T_0) = \ln[X_B - X_H - \rho_{12}(X_B - X_H - 2\Delta_K)]$$

Апостериорная дифференциальная энтропия $h(x_{2k})$ второго измерения находится по формуле (2) при $i = 2$ и $j = k$, а количество информации, извлекаемое ИК во втором измерении с учетом вероятностной зависимости от первого показания x_{1g} ,

$$\begin{aligned} I(x_{1g}, x_{2k}, T_0) &= h(x_{1g}, T_0) - h(x_{2k}) = \\ &= \ln \left[\frac{X_B - X_H - \rho_{12} \left(\frac{X_B - X_H}{2\Delta_K} - 1 \right)}{2\Delta_K} \right] = \\ &= \ln \left[\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - \rho_{12} \left(\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1 \right) \right]. \end{aligned}$$

Аналогично априори i -го измерения условная плотность вероятности $w_1[x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0]$ с учетом предыдущих показаний $x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}$ равна

$$\begin{aligned} w_1[X_i | x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0] &= \\ &= \begin{cases} \frac{1}{X_B(x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0) - X_H(x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0)}, \\ \quad X_H(x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0) \leq X_2 \leq \\ \quad \leq X_B(x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0); \\ 0, \text{ в остальных случаях,} \end{cases} \end{aligned}$$

где разность

$$\begin{aligned} X_B(x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0) - X_H(x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0) &= \\ &= X_B - X_H - (\rho_{1i} \cdots \rho_{(i-1)i}) \times \\ &\times \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \rho_{1(i-1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \rho_{1(i-1)} & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ \cdots \\ 1 \end{pmatrix} (X_B - X_H - 2\Delta_K). \end{aligned}$$

Тогда априорная дифференциальная энтропия i -го измерения

$$\begin{aligned} h(x_{1g}, \dots, x_{(i-1)l}, T_0) &= \\ &= \ln \left[\begin{matrix} X_B - X_H - (\rho_{1i} \cdots \rho_{(i-1)i}) \times \\ \times \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \rho_{1(i-1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \rho_{1(i-1)} & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ \cdots \\ 1 \end{pmatrix} (X_B - X_H - 2\Delta_K) \end{matrix} \right] \end{aligned}$$

и количество получаемой информации в i -м измерении с учетом выражения (2) равно

$$\begin{aligned} I(x_{1g}, \dots, x_{ij}, T_0) &= \\ &= \ln \left[\begin{matrix} \frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - (\rho_{1i} \cdots \rho_{(i-1)i}) \times \\ \times \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \rho_{1(i-1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \rho_{1(i-1)} & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ \cdots \\ 1 \end{pmatrix} \left(\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1 \right) \end{matrix} \right]. \end{aligned}$$

Количество информации $I(T, T_0)$, извлекаемое ИК за все время эксперимента $T = (n - 1)T_0$, в течение которого сделано n измерений, равно

$$\begin{aligned} I(T, T_0) &= \sum_{i=1}^n I(x_{1g}, \dots, x_{ij}, T_0) = \\ &= \ln \frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} + \sum_{i=2}^n \ln \left[\begin{matrix} \frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - (\rho_{1i} \cdots \rho_{(i-1)i}) \times \\ \times \begin{pmatrix} 1 & \cdots & \rho_{1(i-1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \rho_{1(i-1)} & \cdots & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ \cdots \\ 1 \end{pmatrix} \left(\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1 \right) \end{matrix} \right]. \end{aligned} \tag{3}$$

Это количество информации равно максимальному $I(T)$ при шаге дискретизации $T_0 = 0$. Найти $I(T)$ можно задавшись корреляционной функцией ρ_{ij} случайного процесса. Нормируя долю извлекаемого количества информации $I(T, T_0)$ от максимально возможного $I(T)$, выбирают шаг дискретизации T_0 [2]. Как это делается, рассмотрим на конкретном примере.

Если рассматриваемый случайный процесс обладает еще и марковским свойством, то $\rho_{(i-1)i} = e^{-\alpha T_0}$, где $0 \leq \alpha < \infty$ – коэффициент динамичности [9]. Тогда выражение (3) примет вид

$$\begin{aligned} I(T, T_0) &= \sum_{i=1}^n I(x_{ij}, T_0) = \\ &= \ln \frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} + \frac{T}{T_0} \ln \left[\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - e^{-\alpha T_0} \left(\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1 \right) \right]. \end{aligned} \tag{4}$$

Из выражения (4) видно, что оптимизируется по αT_0 только второе слагаемое, которое представим в виде

$$\frac{I(T, T_0) - \ln(\sigma_x / \sigma_\delta)}{\alpha T} = \frac{1}{\alpha T_0} \ln \left[\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - e^{-\alpha T_0} \left(\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1 \right) \right]. \tag{5}$$

При $\alpha T_0 = 0$ выражение (5) принимает максимальное значение, равное

$$\frac{I(T) - \ln(\sigma_x / \sigma_\delta)}{\alpha T} = \frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1.$$

Поделив на него выражение (5), получим относительное количество извлекаемой информации в виде

$$J = \frac{I(T, T_0) - \ln(\sigma_x / \sigma_\delta)}{I(T) - \ln(\sigma_x / \sigma_\delta)} = \ln \left[\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - e^{-\alpha T_0} \left(\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1 \right) \right] / \alpha T_0 \left(\frac{\sigma_x}{\sigma_\delta} - 1 \right). \tag{6}$$

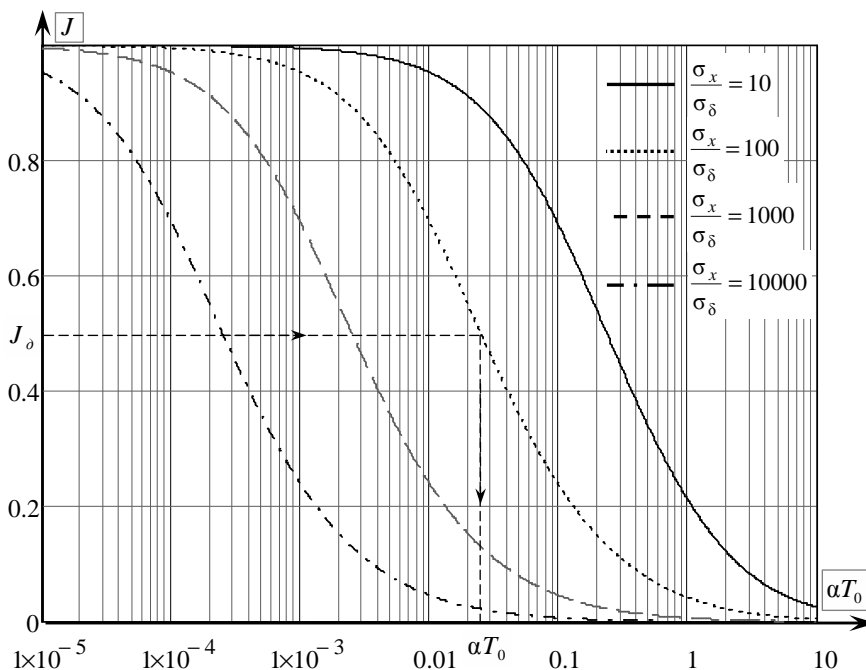
Графики зависимости J от αT_0 для различных значений отношения σ_x / σ_δ согласно выражению (6) приведены на рисунке.

Он показывает, какая часть измерительной информации J извлекается ИК с шагом дискретизации T_0 от максимально возможного при $T_0 = 0$. Приравняв ее достаточному для достижения цели эксперимента значению J_0 и проведя горизонталь до кривой с известным отношением σ_x / σ_δ , опустим перпендикуляр на ось абсцисс, найдем произведение αT_0 , из которого получим требуемый шаг дискретизации T_0 [2].

Сравним этот критерий с известным корреляционным критерием Н. А. Железнова, при котором шаг T_0 выбирается так, чтобы корреляцией между соседними показаниями ИК можно было пренебречь [10]. Так, при $\rho_{12} = e^{-\alpha T_0} = 0,05$ это выполняется, если $\alpha T_0 = 2,996$. Подставив это значение в выражение (6), получим, например, при $(\sigma_x / \sigma_\delta) = 100$ $J = 0,005$, а при $(\sigma_x / \sigma_\delta) = 1000$ $J = 0,002$. Это означает, что выбор T_0 по корреляционному критерию позволяет извлечь только 0,5% измерительной информации при $(\sigma_x / \sigma_\delta) = 100$ и 0,2% при $(\sigma_x / \sigma_\delta) = 1000$. Следовательно, практически вся измерительная информация при этом теряется.

Отметим также, что квантовый критерий Ф. Е. Темникова выбора шага дискретизации T_0 требует знания максимального значения первой производной измеряемого сигнала [11]. При измерении случайных процессов это невозможно и квантовый критерий в этом случае неприменим.

Заметим попутно, что с помощью предлагаемого информационного критерия можно нормировать и потерю относительного количества измерительной информации из-за дискретности показаний во времени, которая составляет $1 - J$.



Выводы. Развиваемый информационный критерий дискретизации позволяет выбрать шаг дискретизации T_0 реализации случайного процесса, нормируя потери измерительной информации за время эксперимента T с учетом погрешности ИК. Эта задача решается комплексно с учетом свойств источника измерительной информации и применяемого для этой цели ИК. Разработанная модель случайного процесса проста и удобна для оптимизации измерительного эксперимента.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Сахо Э. А. Информационный критерий определения периода отсчетов при представлении непрерывно изменяющихся величин в цифровом коде // Измерительная техника. 1973. № 5. С. 19–20.
2. Заико А. И. Информационный критерий равномерной дискретизации // Измерительная техника. 1976. № 9. С. 18–20.
3. Горевич В. М., Пицкель Б. С., Ратмиров В. А. Информационный критерий выбора числа точек контроля изделий // Измерительная техника. 1978. № 4. С. 15–17.
4. Информационный критерий оценки эффективности измерительных устройств / А. В. Балыков [и др.] // Ползуновский альманах. 2009. № 2. С. 164–169.
5. Заико А. И. Случайный сигнал с равномерным законом распределения // Измерительная техника. 1999. № 1. С. 9–11.
6. Свид. 72200700005. Случайный процесс Заико А.И. с равномерным законом распределения. Математическая модель. Зарег. ФГУП «ВНТИЦ» 28.02.07 г. Описание. 10 с.
7. Заико А. И. Многомерные характеристики случайного процесса Заико с равномерным законом распределения // Вестник УГАТУ. Т. 14. 2010. С. 117–122.
8. Куликовский Л. Ф., Заико А. И. Информационная оценка погрешности ИИС в динамическом режиме // Измерительная техника. 1974. № 6. С. 53–55.
9. Заико А. И. Случайные процессы. Модели и измерения. М.: Изд-во МАИ, 2006. 211 с.
10. Железнов Н. А. Принцип дискретизации стохастических сигналов с неограниченным спектром и некоторые результаты теории импульсной передачи сообщений // Радиотехника и электроника. 1958. № 1. С. 3–18.
11. Темников Ф. Е. Теория разветвляющихся систем. М.–Л.: Госэнергоиздат, 1963. 168 с.

ОБ АВТОРЕ

Заико Александр Иванович, проф. каф. теоретич. основ электротехники. Дипл. инж. электронной тех-ки (УАИ, 1970). Д-р техн. наук по информац.-измерит. системам (ЛЭТИ, 1990). Заслуж. изобретатель РБ и РФ. Член-кор. Междунар. инж. акад. Иссл. в обл. метрологич. обеспечения, анализа и синтеза информац.-измерит. систем